PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305917

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027

(21)Application number: 03-094863

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

(72)Inventor: OZEKI HISAO

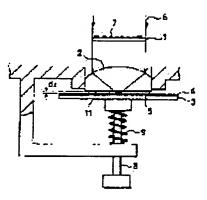
MATSUBARA TAKASHI

(54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To thin film thickness of an immersion liquid and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device.

CONSTITUTION: The adhesive surface 11 of an exposure lens is hydrophilic—treated by a hydrophilic solution such as alcohol. A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on the hydrophilic—treated adhesive surface 11 through an immersion liquid 5, and the pattern 7 of a photomask 1 is transferred onto the wafer 3 by the irradiation of irradiation light 6. Wafer absorbing properties are improved in the hydrophilic—treated adhesive surface 11, and the film thickness of the immersion liquid 5 is made thin.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-305917

(43)公開日 平成4年(1992)10月28日

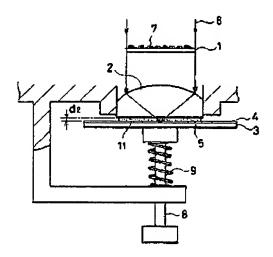
(51) Int Cl. 3 H 0 1 L 21/02	織別配号	庁内整理番号 7018—4M 7352—4M	FI				技術表示箇所		
			H01L	21/30		341 S 311 A			
			!	水钴产等	未甜浆	萧求	質の数1(全	3 夏)	
②1)出題番号	特頭平3-94863		(71)出題人	000004113 株式会社	_		, ,		
(22)出頭日	平成3年(1991)4		東京都千	大区田外	での内は	3丁目2番39	导		
			(72)発明者 大関 尚夫 東京都品川区西大井一丁目 6番 3 号 株式 会社ニコン大井製作所内						
			(72) 発明者		川区西力		「自6番3号 り	次式	
			(74)代理人	弁 理士 (ம்ய த	樹			

(54) 【発明の名称】 密着型質光装置

(57) 【張約】

【目的】 ・ 密着型弱光装置において、 浸液の膜厚を薄く して光の吸収量を少なくし、 露光ムラを軽減防止するこ とを目的とする。

【樹成】 館光レンズの密着面11をアルコール等の親 水溶液によって親水化処理する。この親水化処理された 密着面11にフォトレジスト4を整布されたウエハ3を 起被5を介して密着させ、照射光6の照射によりフォト マスク1のパターン7をウエハ3上に転写する。親水化 処理された密着面11は、吸水性が向上し、浸液5の膜 厚を薄くする。



(2)

特開平4-305917

【特許請求の範囲】

【請求項1】 投影光学系もしくはフォトマスクのウエ 八密着面を額水化処理し、この親水化処理された密着面 にフォトレジストを堕布されたウエハを浸液を介して密 着させ、照射光の照射によりフォトマスクのパターンを 前記フォトレジストに転写するようにしたことを特徴と する密着型露光姿団。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LSIの製造工程にお 10 いて、フォトマスク上のパターンをウエハ上に役影露光 する露光波冠、特に密管型露光弦管に関するものであ

[0002]

【従来の技術】レーザー光等を照射しフォトマスク上の パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導 体基板上に投影電光するこの種の露光装置における電光 方式としては、①密着(コンタクト)個光方式、②プロ キシミティ魔光方式、③反射型投影魔光方式、④縮小レ ンズ投影展光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着因光方式は、フォトマスク (または投影光学系)とウェハとを密着させて観光する もので、これらが完全に告着している場合には、フォト レジスト中の波長が屈折率分の1に短くなるため、回折 の影響が少なく、商保豫度の転写が得られるという特色 を有している。しかし、完全な密菪を実現することは叡 めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的に辞 他させているためにウエハ表面の突起等によりフォトマ スクに欠陥が生じ、その寿命を低下させると同時にデバ イスの歩留りに影響を及ばすといった問題があった。

【0004】そこで、密着露光方式によるこのような問 題を解決する方法としてフォトマスクとウェハ間に液体 (複談)を充填している。图2は投影光学系にウエハを 管着させた場合を示すもので、1はフォトマスク、2は 投影光学系の一部を構成する超光レンズ、3はフォトレ ジスト4が整布されたウエハ、5は歴光レンズ2とウエ ハ3間に充填された浸液、6はフォトマスク1のパター ン?を照射しフォトレジスト4を開光する照射光、8は ウエハ3を保持する保持体、9は保持体8を上方に付勢 しウエハ3を露光レンズ2に押し付ける圧縮コイルばね 40 である。 照射光 6 の波長は短いほど回折の影響が少な く、そのため光源としてエキシマレーザー等のレーザー 装置が用いられる。 浸液 5 としては、 屈折率がフォトレ ジスト4と同程度で光の吸収が少なく、しかもフォトレ ジスト4を溶かさないものが望ましく。 通常純水が使用 される。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述し たような浸数5を使用した密着型露光装置においては、

の吸収量にムラが生じるため、コンタクト爆発されたフ オトレジスト4のパターンが的確に露光されている部分 とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ た。したがって、このような露光ムラの発生を防止する ため、侵被5の秩序は1を薄くし、光の吸収ムラを少な くすることが望まれている。

【0006】本発明は上述したような従来の問題点およ び要望に鑑みてなされたもので、その目的とするところ は、浸液の膜厚を薄くし、露光ムラを軽減防止し得るよ うにした密着型露光装置を提供することにある。

[00007]

【課題を無決するための手段】本発明は上記目的を達成 するため、投影光学系もしくはフォトマスクのウェハ袋 着面を親水化処理し、この親水化処理された密着面にフ オトレジストを塗布されたウエハを浸波を介して密管さ せ、服射光の照射によりフォトマスケのパターンを前記 フォトレジストに転写するようにしたものである。

100081

【作用】本発明において、糧水化処類された投影光学系 もしくはフォトマスクのウエハ密着画は、吸水性が向上 し、浸液の膜原を薄くする。

[0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る審着型露光装置の 一実施例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一構成部品のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を省略する。本実施例は投影光学系にウエハを密 着させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の 一部を構成する露光レンズ2のウエハ密着面11を予め 30 親水化処理し、この親水化処理された密岩面11にウエ ハ3を施水等の侵続5を介して密着させ、照射光6の展 射によりフォトマスク 1のパターン 7をウエハ3上に転 写するようにしたものである。

【0010】 類水化処理は、アルコール系等の頼水溶液 で密着面11を奇麗に拭き、レンズ表面の汚れを取るこ とで行なわれる。そして、この親水化処理後密着面11 にウエハ3を浸液5を介して密着させ、ウエハ3を露光 レンズ2にばね9により所定圧にて押しつける。

【0011】かくしてこのような構成においては、親水 化処理によって密着面 1 1 の吸水性を向上させているの で、親水化処理を施さなかったときと比較して浸液5の 吸水効果が大きく、したがって、包液5の表面張力が小 さくなって濡れ性が上がるため、浸漱5の態厚 d2 を図 2に示した従来装置と比較して薄くする(d2 くd1) ことができ、また膜原が深くなれば光の吸収量も少なく なるので、これに比例して光の吸収ムラが減少し、経光 ムラを軽減防止することができる。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密着型 浸液5 自身の腹厚ムラがあると、浸液5 による照射光6 50 露光装置によれば、投影光学系またはフォトマスクのウ

-98-

(3)

特開平4-305917

エハ密着面を親水化処理し、この親水化処理された密着 面に、フォトレジストを整布されたウエハを根波を介し て密着させるように構成したので、民族自身の表面張力 を減らして濡れ性を向上させることができる。したがっ て、没被の赎罪を募くするかでき、また赎罪が難くなれ ば侵権の膜厚ムラも少なくなるため、光の吸収が少な く、被液による臨光ムラを軽減防止することができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る密着型解光装置の一実施例を示す 要部の断面図である。

【図2】密着型電光装配の従来例を示す妥略の新面図で

ある.

【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 観光レンズ
- 3 ウエハ
- フォトレジスト
- 5 浸液
- 6 殿射光
- 7 マスク
- 10 11 密着面

